Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Направление подготовки/специальность: 11.04.04 Электроника и наноэлектроника

Наименование образовательной программы: Промышленная электроника и микропроцессорная

техника

Уровень образования: высшее образование - магистратура

Форма обучения: Очная

Оценочные материалы по дисциплине Полупроводниковые ключи в силовых схемах

Москва 2024

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

 Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

 Сведения о владельце ЦЭП МЭИ

 Владелец
 Воронин П.А.

 Идентификатор
 R8090f709-VoroninPA-bf2fdc05

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель образовательной программы

Разработчик

NOSO NE	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»		
M _O M	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ		
	Владелец	Рашитов П.А.	
	Идентификатор	R66e8dfb1-RashitovPA-1953162c	

П.А. Рашитов

П.А. Воронин

Заведующий выпускающей кафедрой

NOSO E	Подписано электронн	ой подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
New	Сведен	ия о владельце ЦЭП МЭИ
	Владелец	Асташев М.Г.
	Ивонтификатор	R7a29e524-AstashevMG-05831861

М.Г. Асташев

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. ПК-1 Способен проводить и сопровождать работы по проектированию устройств электроники и наноэлектроники в соответствии с требованиями технического задания ИД-1 Знает современный технологический базис и технические решения и осуществляет выбор на основе технических требований к устройствам электроники и наноэлектроники

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Письменная работа

- 1. Мощные диоды и биполярные транзисторы (Контрольная работа)
- 2. Мощные МДП-транзисторы с индуктивной нагрузкой (Контрольная работа)
- 3. Мощные МДП-транзисторы с резистивной нагрузкой (Контрольная работа)
- 4. Полупроводниковые ключи в мостовых схемах (Контрольная работа)

БРС дисциплины

2 семестр

Перечень контрольных мероприятий <u>текущего контроля</u> успеваемости по дисциплине:

- КМ-1 Мощные диоды и биполярные транзисторы (Контрольная работа)
- КМ-2 Мощные МДП-транзисторы с резистивной нагрузкой (Контрольная работа)
- КМ-3 Мощные МДП-транзисторы с индуктивной нагрузкой (Контрольная работа)
- КМ-4 Полупроводниковые ключи в мостовых схемах (Контрольная работа)

Вид промежуточной аттестации – Экзамен.

	Веса контрольных мероприятий, %				
Вормон висумуниции	Индекс	КМ-	КМ-	КМ-	КМ-
Раздел дисциплины	KM:	1	2	3	4
	Срок КМ:	4	8	12	15
Полупроводниковые ключи на основе силовых дио	дов и				
мощных биполярных транзисторов					
Ключи на силовых диодах и биполярных транзисторах		+			
Униполярные полупроводниковые ключи с полевым					
управлением (мощные МДП и индукционные транзисторы)					
Ключи на мощных МДП-транзисторах.			+	+	+

Биполярные полупроводниковые ключи с полевым				
управлением (IGBT и тиристоры с электростатической				
индукцией)				
Ключи на биполярных транзисторах с изолированным				
затвором (IGBT) и ключи на полевых транзисторах со			+	+
статической индукцией.				
Мощные тиристорные ключи, силовые ключи новых				
технологий				
Силовые ключи новых технологий.				+
Bec KM:	25	25	25	25

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Индекс	Индикатор	Запланированные	Контрольная точка
компетенции	_	результаты обучения по	
		дисциплине	
ПК-1	ИД-1 _{ПК-1} Знает	Знать:	КМ-1 Мощные диоды и биполярные транзисторы (Контрольная
	современный	базовые структуры и	работа)
	технологический базис и	основные этапы	КМ-2 Мощные МДП-транзисторы с резистивной нагрузкой
	технические решения и	переходных процессов	(Контрольная работа)
	осуществляет выбор на	переключения тиристоров	КМ-3 Мощные МДП-транзисторы с индуктивной нагрузкой
	основе технических	новых технологии	(Контрольная работа)
	требований к устройствам	базовые структуры и	КМ-4 Полупроводниковые ключи в мостовых схемах (Контрольная
	электроники и	основные этапы	работа)
	наноэлектроники	переходных процессов	
		переключения IGBT при	
		работе на комплексную	
		нагрузку	
		базовые структуры и	
		основные этапы	
		переходных процессов	
		переключения биполярных	
		транзисторных ключей при	
		работе на комплексную	
		нагрузку	
		базовые структуры и	
		основные этапы	
		переходных процессов	
		переключения ключей на	
		МДП-транзисторах при	
		работе на комплексную	

нагрузку	
Уметь:	
рассчитывать	
-	
электромагнитные	
процессы в схемах	
тиристоров новых	
технологий	
рассчитывать	
электромагнитные	
процессы в схемах на	
МДП-транзисторах	
рассчитывать	
электромагнитные	
процессы в схемах	
биполярных	
транзисторных ключей	
рассчитывать	
электромагнитные	
процессы в схемах на	
IGBT	

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. Мощные диоды и биполярные транзисторы

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Каждый студент получает

индивидуальное задание.

Краткое содержание задания:

Переходные процессы в мощных диодах и биполярных транзисторах

Контрольные вопросы/задания:

топтроивные вопросы/задания	
Запланированные результаты обучения по	Вопросы/задания для проверки
дисциплине	
Знать: базовые структуры и основные	1.Построить диаграммы переходного
этапы переходных процессов	процесса выключения мощного диода
переключения биполярных транзисторных	2.Построить диаграммы переходного
ключей при работе на комплексную	процесса переключения мощного
нагрузку	биполярного транзистора
Уметь: рассчитывать электромагнитные	1.Рассчитать амплитуду обратного тока
процессы в схемах биполярных	диода, основные динамические параметры
транзисторных ключей	диода при выключении, энергию и
	мощность динамических потерь в диоде
	при выключении
	2. Рассчитать критический ток транзистора
	на границе преднасыщения и основные
	динамические параметры транзистора

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 80

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-2. Мощные МДП-транзисторы с резистивной нагрузкой

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Каждый студент получает

индивидуальное задание.

Краткое содержание задания:

Переходные процессы в мощных МДП-транзисторах с резистивной нагрузкой

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по	Вопросы/задания для проверки
дисциплине	
Знать: базовые структуры и основные этапы переходных процессов переключения ключей на МДП-транзисторах при работе на комплексную нагрузку	1. Нарисовать эквивалентную схему ключа на мощном МДП-транзисторе с учетом всех емкостных составляющих. Пояснить физическую сущность эффекта Миллера. 2. Построить диаграммы переходного процесса переключения мощного МДП-транзистора.
Уметь: рассчитывать электромагнитные процессы в схемах на МДП-транзисторах	1. Рассчитать кажущуюся входную емкость МДП—транзистора при действии эффекта Миллера 2. Рассчитать основные динамические параметры транзистора, мощность и энергию динамических потерь.

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 80

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-3. Мощные МДП-транзисторы с индуктивной нагрузкой

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Каждый студент получает индивидуальное задание.

Краткое содержание задания:

Переходные процессы в мощных МДП-транзисторах с индуктивной нагрузкой

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения	Вопросы/задания для проверки
по дисциплине	
Знать: базовые структуры и основные	1.Построить диаграммы переходного
этапы переходных процессов	процесса переключения мощного МДП–
переключения ключей на МДП-	транзистора при работе на индуктивную
транзисторах при работе на	нагрузку.
комплексную нагрузку	
Знать: базовые структуры и основные	1. Нарисовать схему транзисторного ключа с
этапы переходных процессов	индуктивной нагрузкой, шунтированной
переключения IGBT при работе на	диодом.
комплексную нагрузку	2. Нарисовать схему полумоста на IGBT с
	индуктивной нагрузкой.
Уметь: рассчитывать электромагнитные	1. Рассчитать скорость изменения тока стока
процессы в схемах на МДП-	транзистора при включении и выключении.
транзисторах	Пояснить влияние паразитной индуктивности
	в цепи коммутации на диаграммы процессов
	переключения.
	2. Рассчитать основные динамические
	параметры транзистора, мощность и энергию
***	динамических потерь.
Уметь: рассчитывать электромагнитные	1. Рассчитать энергию динамических потерь в
процессы в схемах на IGBT	схеме при заданном электрическом режиме
	работы схемы с учетом процессов обратного
	восстановления встречно-параллельного
	диода.

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 80

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-4. Полупроводниковые ключи в мостовых схемах

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Каждый студент получает

индивидуальное задание.

Краткое содержание задания:

Расчет статических и динамических потерь в МДП-ключах

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения	Вопросы/задания для проверки
по дисциплине	
Знать: базовые структуры и основные	1.Построить диаграммы переходного процесса
этапы переходных процессов	переключения мощного МДП-транзистора при
переключения ключей на МДП-	работе на индуктивную нагрузку в схеме
транзисторах при работе на	полумоста.
комплексную нагрузку	
Знать: базовые структуры и основные	1. Нарисовать схему транзисторного и
этапы переходных процессов	тиристорного ключей с индуктивной нагрузкой
переключения тиристоров новых	для схемы полумоста. Пояснить влияние
технологии	паразитной индуктивности в цепи коммутации
	на диаграммы процессов переключения.
Знать: базовые структуры и основные	1.Сравнить режимы работы МДП-ключа и
этапы переходных процессов	IGBT в мостовой схеме
переключения IGBT при работе на	
комплексную нагрузку	
Уметь: рассчитывать	1. Рассчитать скорость изменения тока стока
электромагнитные процессы в схемах	транзистора при включении и выключении.
на IGBT	2.Рассчитать основные динамические
	параметры транзистора, мощность и энергию
	динамических потерь.
Уметь: рассчитывать	1.Определить параметры кусочно-линейно
электромагнитные процессы в схемах	аппроксимации выходной ВАХ МДП-
тиристоров новых технологий	транзистора, IGBT и тиристора

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 80

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

2 семестр

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Пример билета

- 1. Составляющие прямого напряжения силового диода
- 2. IGBT ключи в инверторных схемах, оценка мощности потерь в отдельной фазе
- Практическое задание: рассчитать начальную скорость нарастания тока стока МДП-транзистора при включении на индуктивную нагрузку, шунтированную диодом, в режиме непрерывного тока.

Процедура проведения

Каждый студент получает индивидуальный билет и готовит ответ в течение не более чем 60 минут. Ответ - в устной форме на основе подготовки.

I. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины

1. Компетенция/Индикатор: ИД- $1_{\Pi K-1}$ Знает современный технологический базис и технические решения и осуществляет выбор на основе технических требований к устройствам электроники и наноэлектроники

Вопросы, задания

- 1.
- 1. 1) Составляющие прямого напряжения силового диода
 - 2) IGBT ключи в инверторных схемах, оценка мощности потерь в отдельной фазе
 - 3) Практическое задание: рассчитать начальную скорость нарастания тока стока МДП–транзистора при включении на индуктивную нагрузку, шунтированную диодом, в режиме непрерывного тока.
 - 2.
- 1. 1) Структура мощного биполярного транзистора, расчет динамических параметров переключения
- 2. 2) Ключ на МДП транзисторе с общим истоком в схеме с резистивной нагрузкой, расчет временных параметров и потерь мощности
- 3. 3) Практическое задание: Рассчитать величину паразитной индуктивности в контуре коммутации МДП—транзистора при включении на индуктивную нагрузку, шунтированную диодом, в режиме непрерывного тока.
 - 3
- 1. 1) Базовые структуры мощных МДП транзисторов с коротким каналом, схема замещения транзистора
 - 2) Полевой и биполярный режимы переключения транзисторов со статической индукцией
 - 3) Практическое задание: Рассчитать задержку включения МДП-транзистора при работе на индуктивную нагрузку, шунтированную диодом, в режиме непрерывного тока.

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Каков основной механизм пробоя силовых полупроводниковых ключей?

Ответы:

- а) туннельный
- б) сквозной
- в) лавинный
- г) не пробиваются

Верный ответ: в) лавинный

2. Какой транзистор является нормально открытым прибором?

Ответы:

- а) биполярный транзистор
- б) МДП-транзистор с индуцированным каналом
- в) индукционный транзистор
- г) транзистор Дарлингтона

Верный ответ: в) индукционный транзистор

3. Какую структуру имеет силовой диод?

Ответы:

- a) p-n
- б) p-n-p-n
- в) p-n-p
- г) p-n-n

Верный ответ: г) р-п-п

4.В каком слое силового биполярного транзистора сосредоточено электрическое поле в закрытом состоянии?

Ответы:

- а) в эмиттере
- б) в базе
- в) в высоколегированном коллекторе
- г) в низколегированном коллекторе

Верный ответ: г) в низколегированном коллекторе

5. Какую структуру имеет силовой биполярный транзистор?

Ответы:

- a) n-p-n
- б) p-n-p-n
- в) p-n-p
- г) n-p-n-n

Верный ответ: г) n-p-n-n

6. Какой тип тиристора называется запираемым?

Ответы:

- а) однооперационный
- б) двухоперационный
- в) семистор
- г) динистор

Верный ответ: б) двухоперационный

7. Для какого типа тиристора требуется подключение узла коммутации?

Ответы:

- а) однооперационный
- б) двухоперационный
- в) семистор
- г) линистог

Верный ответ: а) однооперационный

8. Какой тип канала имеет силовой МДП-транзистор?

Ответы:

а) встроенный

- б) индуцированный
- в) низкоомный
- г) параллельный

Верный ответ: б) индуцированный

- 9. Какой параметр характеризует усилительные свойства силовых полевых транзисторов?
- а) альфа
- б) бета
- в) гамма
- г) крутизна

Верный ответ: г) крутизна

- 10. Какой слой высоковольтного МДП-транзистора имеет максимальное сопротивление? Ответы:
- а) высоколегированный слой истока
- б) низколегированный слой стока
- в) высоколегированный слой стока
- г) подложка

Верный ответ: б) низколегированный слой стока

11. Какой тип тиристора коммутирует силовой ток в электрод управления?

Ответы:

- а) одноопрационный
- б) двухоперационный
- B) IGCT
- г) GTO

Верный ответ: в) IGCT

12. Каким напряжением управляются полевые транзисторы?

Ответы:

- а) затвор-сток
- б) сток-исток
- в) затвор-исток
- г) управляются током

Верный ответ: в) затвор-исток

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно. на вопросы углубленного уровня

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Не выполнены условия для оценки "3"

ІІІ. Правила выставления итоговой оценки по курсу

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой и аттестационной составляющих.